

ML Handbook

s.pol

Оглавление

1	Математика	6
1.1	Случайная величина	6
1.2	Распределение случайной величины	6
1.3	Выборка	7
1.4	Закон больших чисел	7
1.5	Центральная предельная теорема	7
1.6	Статистики	7
1.7	Bootstrap	8
1.8	Классический и байесовский подход	8
1.9	Метод максимального правдоподобия	8
1.10	Доверительный интервал	8
1.11	Байесовский доверительный интервал	8
1.12	Основные дискретные распределения	8
1.13	Основные непрерывные распределения	8
1.14	Матричные разложения	8
1.15	К-Л дивергенция	9
1.16	Энтропия	9
1.17	Квантили	9
1.18	Точечные оценки	9
1.19	Интервальные оценки	9
1.20	Проверка гипотез	9
1.21	Множественная проверка гипотез	9
1.22	Параметрические и непараметрические критерии, бутстреп	9
1.23	Ошибки I и II рода	9
1.24	Достигаемый уровень значимости	9
1.25	Мощность статистического критерия	9
1.26	Основные задачи статистики	9
1.27	Проверка основных гипотез	10
1.28	Корреляция Пирсона	10
1.29	Корреляция Спирмена	10
1.30	Корреляция Метьюса	10
1.31	Корреляция Крамера	10
1.32	Z-тест Фишера	10
1.33	T-тест Стьюдента	10

1.34	Критерий Пирсона χ^2	10
1.35	Точный тест Фишера	10
2	Анализ данных	11
2.1	Типы данных	11
2.2	Предобработка данных	11
2.3	Понижение размерности	11
3	Общие вопросы	12
3.1	Машинное обучение	12
3.2	Основные классы задач	12
3.3	Обнаружение аномалий	12
3.4	Контроль качества	12
3.5	Недообучение	13
3.6	Переобучение	13
3.7	Регуляризация	13
3.8	Отбор признаков	13
3.9	Параметры алгоритма	13
3.10	Подбора метапараметров	13
3.11	Основные типы алгоритмов	13
3.12	Многоклассовая классификация	13
3.13	Дисбаланс классов	13
3.14	Ансамбли алгоритмов	13
3.15	Метрики классификации	13
3.15.1	Accuracy	13
3.15.2	Precision	14
3.15.3	Полнота (recall)	14
3.15.4	F1-мера	14
3.15.5	F-мера	14
3.15.6	ROC-AUC	15
3.15.7	PR-AUC	15
3.16	Метрики многоклассовой классификации	16
3.17	ROC-AUC метрика	16
3.18	Индекс Джини	16
3.19	Метрики регрессии	16
3.20	Метрики кластеризации	16
3.21	Разложение ошибки алгоритма	16
3.22	Кривые валидации	16
3.23	Кривые обучения	16
3.24	Метрические методы	16
3.25	Метод ближайших соседей	16
3.26	Линейные методы	16
3.27	Линейная регрессия	16
3.28	Логистическая регрессия	16
3.29	SVM	16
3.30	Ядра и спрямляющие пространства	16

3.31 Решающие деревья	16
3.32 Случайный лес	16
3.33 Градиентный бустинг	17
3.34 Байесовские методы	17
4 Нейросети	18

Предисловие

В данной книге описаны основные понятия, методы и подходы, широко используемые в современном DS и ML. Обычно, свободное владение этими понятиями необходимо для правильного понимания как основных, так и продвинутых методов ML и по умолчанию предполагается от DS специалиста.

Здесь собраны разные определения, встречавшиеся автору в научных статьях по ML и на собеседованиях. Охвачены: теория вероятностей, классическая и байесовская статистика, некоторые вопросы мат. анализа.

Освещение вопросов ни в коем случае не претендует на полноту и в некоторых случаях на строгость. Основная цель книги - составить расширенный глоссарий основных понятий и подходов, встретившихся автору в процессе работы в области ML.

Обозначения

DS	- наука о данных
ML	- машинное обучение
RV	- случайная величина
CDF	- функция распределения случайной величины
PDF	- плотность распределения случайной величины
CLT	- центральная предельная теорема
EX	- среднее случайной величины X
DX	- дисперсия случайной величины X
$X \sim Y$	- случайные величины X и Y одинаково распределены

Глава 1

Математика

В этой главе описаны основные математические понятия, необходимые для правильного понимания как основных, так и продвинутых методов ML. Охвачены: теория вероятностей, классическая и байесовская статистика, некоторые вопросы мат. анализа.

1.1 Случайная величина

Случайной величиной (RV) называется числовая функция X , определенная на некотором множестве элементарных исходов Ω (обычно подмножество \mathbb{R} или \mathbb{R}^n),

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

С прикладной точки зрения на RV часто смотрят как на генераторы случайных чисел с заданным распределением.

Примеры:

- Рост людей, взятых из некоторой группы.
- Цвет фиксированного пикселя изображения, взятого из некоторого множества изображений.
- Некоторый признак из датасета ML задачи.

1.2 Распределение случайной величины

Если RV принимает дискретное множество значений x_1, x_2, \dots , то она полностью определяется значениями их вероятностей: $p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$.

Если множество значений RV не дискретно, то RV может быть описана своей функцией распределения (CDF, Cumulative distribution function): $F(x) = \mathbb{P}(X < x)$.

В большинстве прикладных случаев CDF оказывается дифференцируемой функцией. Производная от CDF называется плотностью распределения случайной величины (PDF, Probability density function): $f(x) = F'(x)$. Таким образом, по определению

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx.$$

1.3 Выборка

Выборкой объема n из генеральной совокупности X называется последовательность независимых и распределенных как X случайных величин:

$$X_1, X_2, \dots, X_n, \quad X_k \sim X$$

На практике под выборкой понимают конкретные реализации величин X_k , то есть последовательность чисел x_1, x_2, \dots, x_n .

1.4 Закон больших чисел

Закон больших чисел утверждает, что если X_1, X_2, \dots, X_n - выборка объема n из генеральной совокупности X , то ее среднее с ростом n стабилизируется к среднему значению X :

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \approx EX, \quad n \rightarrow \infty.$$

1.5 Центральная предельная теорема

Центральная предельная теорема (CLT) является в некотором смысле уточнением закона больших чисел. В упрощенном варианте она утверждает, что если X_1, X_2, \dots, X_n - выборка объема n из генеральной совокупности X , то ее распределение ее среднего при больших n очень близко к нормальному,

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \approx N(\mu, \sigma^2/n), \quad \mu = EX, \sigma^2 = DX, \quad n \rightarrow \infty.$$

Заметим, что если совокупность распределена нормально, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, то предыдущая формула обращается в точное равенство при любых n .

1.6 Статистики

Пусть X_1, X_2, \dots, X_n - выборка объема n . Статистикой называется произвольная RV, являющаяся функцией выборки:

$$T = T(X_1, X_2, \dots, X_n).$$

Часто статистикой называют конкретное значение $T(x_1, x_2, \dots, x_n)$, полученное на данной реализации x_1, x_2, \dots, x_n выборки.

Примеры:

- $\bar{X} = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)/n$ - выборочное среднее.
- $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ - максимальное значение в выборке.
- медиана, перцентили.

1.7 Bootstrap

1.8 Классический и байесовский подход

1.9 Метод максимального правдоподобия

1.10 Доверительный интервал

1.11 Байесовский доверительный интервал

1.12 Основные дискретные распределения

1.13 Основные непрерывные распределения

1.14 Матричные разложения

...может разделить главу на части...

- 1.15 К-Л дивергенция
- 1.16 Энтропия
- 1.17 Квантили
- 1.18 Точечные оценки
- 1.19 Интервальные оценки
- 1.20 Проверка гипотез
- 1.21 Множественная проверка гипотез
- 1.22 Параметрические и непараметрические критерии, бутстреп
- 1.23 Ошибки I и II рода
- 1.24 Достигаемый уровень значимости
- 1.25 Мощность статистического критерия
- 1.26 Основные задачи статистики

...из лекций новосиба курсера...

- 1.27 Проверка основных гипотез
- 1.28 Корреляция Пирсона
- 1.29 Корреляция Спирмена
- 1.30 Корреляция Метьюса
- 1.31 Корреляция Крамера
- 1.32 Z-тест Фишера
- 1.33 T-тест Стьюдента
- 1.34 Критерий Пирсона χ^2
- 1.35 Точный тест Фишера

Глава 2

Анализ данных

Анализ и предобработка данных - первая задача, успешное решение которой зачастую определяет успех в решении любых задач ML. В этой главе описываются основные подходы....

2.1 Типы данных

2.2 Предобработка данных

2.3 Понижение размерности

Глава 3

Общие вопросы

В этой главе приводятся основные понятия ML и DS.

3.1 Машинное обучение

Машинное обучение (ML) - область искусственного интеллекта, изучающая самообучающиеся модели, то есть решающие поставленную задачу не по заранее запрограммированному алгоритму, а предварительно настраивая свое поведение согласно имеющимся данным.

Обычно методы ML содержат свободные параметры, подбор которых наилучшим (в смысле имеющихся данных) образом и составляет процесс обучения алгоритма.

3.2 Основные классы задач

3.3 Обнаружение аномалий

3.4 Контроль качества

...оценка обобщающей способности...

3.5 Недообучение

3.6 Переобучение

3.7 Регуляризация

3.8 Отбор признаков

3.9 Параметры алгоритма

3.10 Подбора метапараметров

3.11 Основные типы алгоритмов

3.12 Многоклассовая классификация

3.13 Дисбаланс классов

...чем плохо... как бороться (over/undersampling/SMOTE)... [http : //www.machinelearning.ru/wiki/index.php/ML_RU:Сбалансированные_данные](http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php/ML_RU:Сбалансированные_данные)

3.14 Ансамбли алгоритмов

3.15 Метрики классификации

Пусть некоторый алгоритм a решает задачу бинарной классификации с классами 0 (негативный) и 1 (позитивный). Тестирование алгоритма a проводится на n объектах, ответы y на которых известны. Пусть TP и TN - числа правильно классифицированных позитивных и негативных объектов соответственно. Аналогично, FP и FN - числа неправильно классифицированных позитивных и негативных объектов соответственно.

О качестве алгоритма a можно судить по матрице ошибок:

	$y=1$	$y=0$
$a=1$	TP	FP
$a=0$	FN	TN

Для оценки качества работы алгоритмов бинарной классификации обычно используются следующие основные метрики:

3.15.1 Ассигасу

Точность (ассигасу) - отношение числа правильных ответов к общему количеству,

$$accuracy = \frac{TP + TN}{n}.$$

Проста в использовании и интерпретации, но плоха для несбалансированных выборок, и потому довольно редко используемая напрямую.

3.15.2 Precision

Точность (precision) - отношение числа правильно классифицированных позитивных объектов к общему количеству позитивно классифицированных,

$$precision = \frac{TP}{TP + FP}.$$

Чем ближе значение к 1, тем меньше ложных срабатываний (FP).

3.15.3 Полнота (recall)

Полнота (recall) - вычисляется как отношение

$$recall = \frac{TP}{TP + FN}.$$

Чем ближе значение к 1, тем меньше ложных пропусков (FN).

3.15.4 F1-мера

F1-мера - среднее гармоническое точности и полноты,

$$F = \frac{2PR}{P + R}.$$

F1-мера усредняет, хорошо ловит и точность, и полноту.

3.15.5 F-мера

Обобщенная F-мера вычисляется как

$$F = (1 + \beta^2) \frac{PR}{\beta^2 P + R}.$$

F-мера усредняет, хорошо ловит и точность, и полноту, имеет настраиваемый параметр β .

3.15.6 ROC-AUC

Большинство алгоритмов бинарной классификации дают в качестве результата не просто 0 или 1, а некоторое число из отрезка $[0, 1]$. Окончательный ответ можно получить, задав некий порог h - число, ниже которого ответ будет считаться принадлежащим классу 0, и выше которого - классу 1.

Подбор наилучшего значения порога - отдельная задача, однако, есть метрики качества, позволяющие оценить алгоритм "в целом без привязки к конкретному значению порога. ROC-AUC - площадь под ROC кривой - одна из наиболее популярных метрик для такого рода оценки качества.

Сама ROC кривая строится в координатах (FPR, TPR) следующим образом: пары реальных ответов y_i и соответствующих ответов алгоритма a_i упорядочиваются по убыванию a_i . Далее идем по получившемуся после сортировки массиву значений y_i и строим ROC кривую, начиная от начала координат и делая шаг вправо, если $y_i = 0$ и вверх, если $y_i = 1$. Важный момент: если рядом оказались несколько a_i с одинаковыми значениями, то соответствующий им участок ROC кривой будет не ступенчатым, а прямолинейным (см. пример ниже).

Пример:

ROC-AUC достаточно устойчива к дисбалансу классов.

3.15.7 PR-AUC

Площадь под PR кривой. Хороша, когда негативных объектов гораздо больше, чем позитивных.

- 3.16 Метрики многоклассовой классификации
- 3.17 ROC-AUC метрика
- 3.18 Индекс Джини
- 3.19 Метрики регрессии
- 3.20 Метрики кластеризации
- 3.21 Разложение ошибки алгоритма
- 3.22 Кривые валидации
- 3.23 Кривые обучения
- 3.24 Метрические методы
- 3.25 Метод ближайших соседей
- 3.26 Линейные методы
- 3.27 Линейная регрессия
- 3.28 Логистическая регрессия
- ...отличие от линейной...
- 3.29 SVM
- 3.30 Ядра и спрямляющие пространства
- 3.31 Решающие деревья
- 3.32 Случайный лес

...отличие от беггинга над решающими деревьями...

3.33 Градиентный бустинг

3.34 Байесовские методы

Глава 4

Нейросети

В данной главе приводится обзор основных понятий и методов, связанных с нейросетями.